

## EMI 수치해석을 위한 주파수에 따른 마이크로파 인쇄회로기판의 비유전율의 측정에 관한 연구

장인범<sup>\*</sup>, 김영천<sup>\*\*</sup>, 김충혁<sup>\*</sup>, 이준웅<sup>\*</sup>

\* : 광운대학교 전기공학과

\*\* : 서울산업대 전기공학과

A study on the measuring of relative permittivity of microwave PCB  
with frequency for the numerical analysis of EMI

In-Bum Jang<sup>\*</sup>, Yong-Chun Kim<sup>\*\*</sup>, Chung-Heok Kim<sup>\*</sup>, Joon-Ung Lee<sup>\*</sup>

\* : Dept. of Electrical Eng., Kwangwoon Univ.

\*\* : Dept. of Electrical Eng., Seoul National Polytechnic Univ.

**Abstract** - In this paper, to analyze electromagnetic distribution, measure the variation of relative permittivity of Glass-epoxy substrate for Computer-main-board and Teflon substrate for handphone or PCS in the frequency range 100[MHz]~ 1[Ghz], in room temperature.

To measure relative permittivity, suggested the Microstripline method

As the frequency increase, the variation of relative permittivity of Glass-epoxy is bigger than Teflon's.

And simulate the electromagnetic distribution on the PCBs in the infinite region applying the open boundary condition with these results by Finite Element Method

### 1. 서론

본 논문은 초고주파 인쇄회로기판의 전자과 분포를 해석하기 위해 주파수에 따른 인쇄회로기판의 비유전율의 측정방법에 관하여 연구한 것이다. 인쇄회로기판의 전자과 분포는 주변의 온도, 습도 및 주파수에 따라 큰 영향을 받기 때문에 정확한 해석을 위해서는 이러한 조건들을 고려하여 해석을 해야하는데 본 논문에서는 컴퓨터의 Main-board로 쓰이는 Glass-Epoxy와 휴대폰 및 PCS기기의 기판으로 쓰이는 Teflon기판을 상온에서 100[MHz] ~ 1[Ghz]사이의 주파수 변화에 따른 비유전율의 변화를 관측하여 이를 초고주파 인쇄회로기판의 전자과 해석에 이용하도록 하였다.

본 논문에서는 마이크로스트립라인법을 이용하여 비유전율을 측정하였는데 두 가지 기판 모두 주파수가 증가함에 따라 비유전율이 감소하다 증가하는 경향을 보였으며 Glass-epoxy 기판이 Teflon기판보다 변화폭이 더 큼을 알 수 있었다.

또한, 이를 유한요소법을 통해 주파수에 따른 비유전율의 변화에 의한 전계 분포를 계산하여 그 결과를 나타내었다.

### 2. PCB의 비유전율 측정

#### 2-1 스트립선로제작 및 측정방법

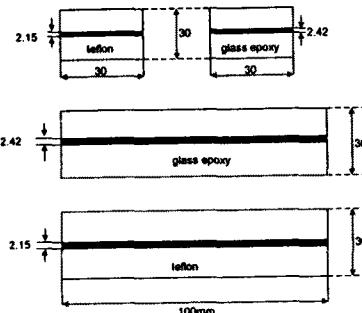
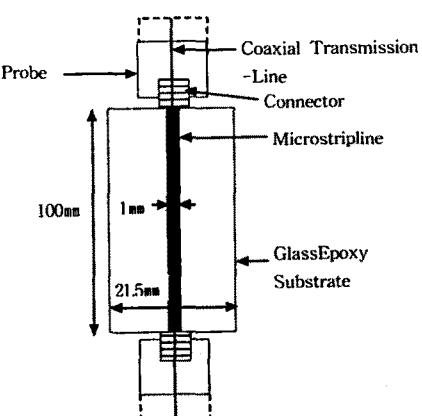


그림 2.1 Teflon과 glass epoxy 기판위의  
마이크로스트립라인 설계

To network Analyzer(Port1)



To network Analyzer(Port2)

그림 2.2 마이크로스트립라인과 Network Analyzer의 연결

제작한 microstrip line을 갖고 network analyzer를 이용하여  $S_{21}$ 과  $S_{12}$ 의 phase을 측정한다. 측정하기 전에 network analyzer를 초기화하여 모든 계기를 0점에 맞추며 주의 할 점은 Reflection에서 각 cable에 open, short 및 load 단자의 연결 시 위상의 변화를 주시해야 한다.

또한, open단자의 Marker 위치와 Short단자의 Marker의 위치는 180도의 위상차가 나야 하며, Load의 Marker 위치는 임피던스 매칭점에 있어야 한다.

$$S_{21} = |S_{21}| e^{j\theta}$$

식 2-1

$S_{21}$ 으로부터 위상차(phase shift)와 감쇠(attenuation)를 구할 수 있다. 감쇠는  $S_{21}$ 의 크기로부터 얻을 수 있고, 위상차는  $S_{21}$ 의 phase로부터 얻을 수 있다. 여기서  $S_{21}$ 는 port1에서 port2 으로의 전송계수(transmission coefficient)를 나타내며,  $S_{12}$ 는 port2에서 port1 으로의 전송계수를 나타낸다. 즉  $S_{21}$ 는 순방향전송계수이며,  $S_{12}$ 는 역방향전송계수이다. 이와 같이 한 시료에 대하여 순방향과 역방향 전송계수 두 가지 측정값의 평균을 구한다. 이렇게 순방향전송계수와 역방향전송계수를 측정하는 이유는 연결 cable에서 발생하는 오차와 microstrip line 제작시 폭이 일정치 않는 구조적인 문제점을 해결하여 측정값에 있어서 오차를 최대한 줄이기 위해서이다.

## 2-2 측정결과

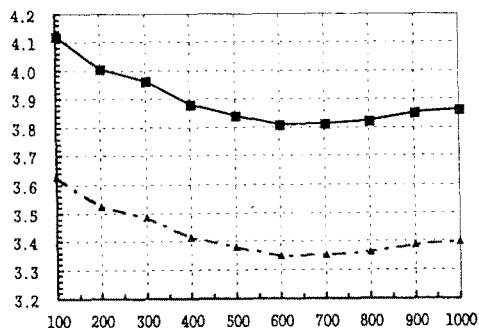


그림 2.3 주파수에 따른 Glass-Epoxy의 비유전율  $\epsilon_r$  및  
실효유전율  $\epsilon_{eff}$

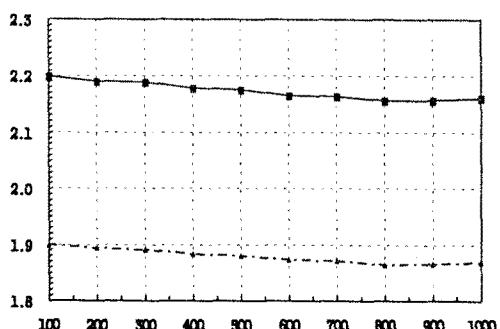


그림 2.4 주파수에 따른 Teflon의 비유전율  $\epsilon_r$  및  
실효유전율  $\epsilon_{eff}$

이상의 그래프를 보면 Glass-Epoxy기판은 100[MHz]에서 비유전율이 4.121로 가장 높았으며 주파수가 증가함에 따라 점점 감소하여 600[MHz]에서 3.811로 최소값이 되었으며 700[MHz]부터 주파수가 증가함에 따라 조금씩 증가하는 형태를 나타내고 있으며 실효유전율도 같은 양상을 보이며 100[MHz]에서 3.629로 최대값을 갖고 600[MHz]에서 3.35로 최소값을 나타내고 있다. Teflon 기판의 경우도 Glass-Epoxy기판과 비슷한 특성을 나타내지만 그 변화량이 Glass-Epoxy기판에 비해 매우 작은 값을 나타낸다. 100[MHz]에서 비유전율이 2.199로 최대값을 나타내고 주파수가 증가함에 따라 비유전율이 점점 감소하다가 800[MHz]에서 비유전율값이 2.156으로 최소가 되었다가 900[MHz]부터 약간씩 비유전율이 증가하는 모습을 볼 수 있다.

## 3. 유한요소법을 이용한 주파수 변화에 따른 스트립라인의 전개분포 해석

### 3-1 해석모델 및 요소분할

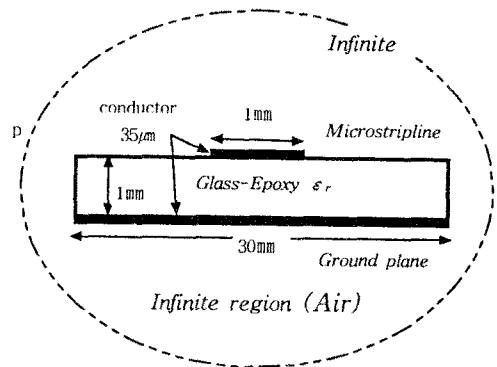


그림 3.1 무한영역내의 스트립라인의 형상

그림 3.1은 무한영역내 비유전율이 4.3인 양면 Glass-Epoxy의 마이크로스트립라인에서 전자계분포를 관측하기 위한 모델이다. 이때 상면의 도체두께는 35 $\mu m$ 이고 유전체의 두께는 1mm이며 마이크로스트립라인 폭은 1mm, 기판의 폭은 30mm로 하였으며 마이크로스트립라인의 전위는 5V를 인가하였다.

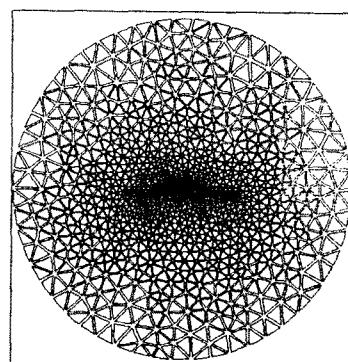


그림 3.2 무한영역내 마이크로스트립라인의 요소분할도

### 3-2 수치해석 결과

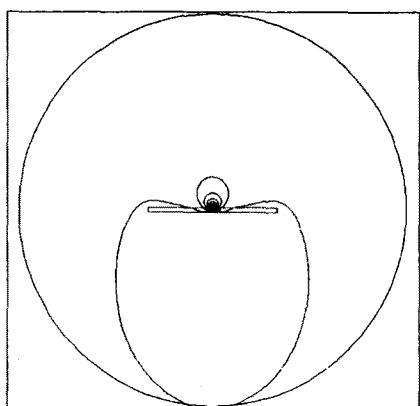


그림 3.3 무한영역내 마이크로스트립라인의 등전위 분포

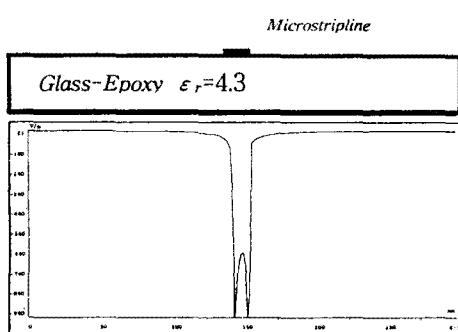


그림 3.4 마이크로스트립라인 하면의 Field 분포

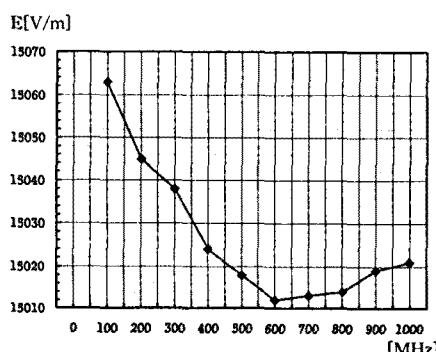


그림 3.5 주파수변화에 따른 스트립라인 하부 끝단의 전계 분포의 변화

### 4 . 결론

PCB 비유전을 측정에서 마이크로스트립선로법을 이용한 결과 실제 마이크로스트립선로가 실장된 PCB의 비유전율은 선로의 구조 및 PCB의 재질에 따라 크게 영향을 받는데 주파수의 영향은 Glass-Epoxy기판이 Teflon기판보다 크게 나타났다.

Glass-Epoxy와 Teflon의 비유전율 최대값과 최소값의 차를 비교해보면 Glass-Epoxy는 100[MHz] ~ 600[MHz] 사이에서 비유전율이 0.31이 감소하였고 Teflon의 경우 100[MHz] ~ 800[MHz] 사이에서 비유전율이 0.036이 감소하여 Glass-Epoxy가 Teflon보다 비유전율이 9배 이상이 변화하였음을 알 수 있다. 따라서, 초고주파회로기판을 사용시 비유전율의 변화가 회로 동작에 많은 영향을 줄 때에는 Glass-Epoxy기판보다 주파수에 따른 비유전율의 변화가 적은 Teflon기판을 사용해야 한다고 사료된다.

이상에서 연구한 PCB기판의 비유전율 측정방법 연구 및 유한요소법에 의한 전자파해석을 이용한다면 점차 집적화 및 고주파수화가 되는 PCB의 전자파장해에 대한 대책을 세울 수 있으며, 이로서 국내 전자 기기의 전자파 해석기술에 크게 기여할 수 있다고 사료된다.

### 참고문헌

1. Numerical Techniques for Microwave and Millimeterwave Passive Structures p449~460
2. Transmission Lines And Waveguides P50~60
3. Microwave Materials and Fabrication Techniques P2~7
4. Microwave Circuits Analysis And CAD p71~75
5. Transmission Line Design Handbook p45~161 Brian C. Wadell
6. Waveguide Components For Antenna Feed Systems Theory And Cad p61~71 Uher, J Bornemann
7. Numerical Methods for Microwave & Millimeterwave Structures p163~229
8. Practical Simulation of Printed Circuit Boards and related structures K. J. Scott